

## 新シリーズ登場

# ヤチヨ製パターン外観検査装置 XETシリーズ

## 大幅なスピードアップ（従来機種との3倍）と検査精度の向上

(株)ヤチヨ・コーポレーション（東京都町田市）より、大幅なスピードアップと検査精度を向上した新しいパターン外観検査装置 XET シリーズが発売になりました。ヤチヨ検査装置は我が国のエッチング業界、プリント基板業界、フォトマスク業界などで、（１）高い検出能力、（２）高いコストパフォーマンス、（３）容易なオペレーション、（４）安いメンテナンスコストなどが高く評価され、約500台以上が稼働しています。新しいXETシリーズはこれらのメリットを残しつつ、（４）検査時間を従来機種との約3倍にスピードアップすると共に（５）検査精度を更に向上させました。XETシリーズには10 - 30 μレベルのパターン欠陥検出を対象とした「Simple タイプA」「Simple タイプB」「Basic タイプ」、3 - 10 μレベルを対象とした「Micron タイプ」、そして0.4 - 5 μレベルを対象とした「Nano タイプ」の5機種がラインナップされており、検査目的に応じて選択することができます。

### XET Micron タイプの主な仕様と性能

検査対象物	フォトマスク、フィルム、ガラス、ガラス基板など
検査物サイズ	MAX 700X750mm
検査物有効サイズ	MAX 550X550mm
検出欠陥の種類	ピンホール、欠け、突起、汚れ、異物付着など
CCDカメラ	500万画素 2次元 CCDカメラ
レンズ倍率 (分解能)	テレセントリックレンズ X1(3.5μ)、X2(1.7μ) X3(1.2μ)
カメラ駆動方式	シャフトモーター(リアモーター)
光源	Xeランプ(透過光)、(反射光はオプション)
欠陥検出 アルゴリズム	デザインルール(DRC)法 面付けパターン比較(Die-to-Die)法 CADデータ比較法
欠陥検出能力	
ピンホール欠陥	分解能の約2倍以上の大きさ(DRC)
欠け、突起欠陥	分解能の約2 - 3倍以上の大きさ(DD比較)
汚れなど	分解能の約5倍以上の大きさ(CAD比較)
検査時間	約 8分(500X500mm, 分解能 3.5μ)

(他の機種との仕様と性能については下記にお問い合わせください)



(株)ヤチヨ・コーポレーションでは上記5機種でのデモ機を用意してお客さまのサンプルでの検証テストを常時行っています。新しいXETシリーズのヤチヨ検査装置は、いろいろな検査目的に適切にお応えできると確信していますので、宜しくご検討賜りますようお願い申し上げます。

「お問い合わせ先」      ハーリーイメージテック(株)  
〒277-0005 千葉県柏市柏 3 - 10 - 29 501  
TEL 04 - 7168 - 9301 FAX 04 - 7168 - 9305  
E-mail [numata@rice.ocn.ne.jp](mailto:numata@rice.ocn.ne.jp)